

SEM/TEM/XAFS/XPS

ユーザーズセミナー

ものづくりにおいて、材料の組織、構造、局所構造は、その材料の物性と密接に関連するため、より正確な材料の評価・解析が求められます。そのため、得られた知見は、新しい材料設計をするための重要な指針となります。

今回、マクロ～ミクロまでの組織、構造、局所構造解析の手段として、電子顕微鏡(SEM/TEM)、放射光によるX線分光計測(XPS/XAFS)を用いた分析技術について、わかりやすく解析事例をご紹介します。

【日 時】平成28年8月8日(月) 13:00 ~ 15:30

【会 場】豊橋技術科学大学 教育研究基盤センター3階セミナー室(305室)

【対 象】学内の教職員・学生及び企業等の技術者・研究者等

【定 員】70名

【日 程】下記のとおり

時 間	内 容	講 師
13:00~13:05	あいさつ	教育研究基盤センター長 教授 滝川 浩史
13:05~14:00	TEM/SEMによる組織・構造解析の基礎と応用	教育研究基盤センター 教授 中野 裕美
14:00~14:05	休憩	
14:05~15:30	放射光によるX線分光計測(XAFS、XPS)を用いた電子構造解析の基礎と応用	立命館大学 総合科学技術研究機構 SRセンター 研究教員(准教授) 中西 康次 氏

★資料準備のため、参加を希望される場合は下記まで事前にお申し込みください。

(お名前、ご所属、連絡先(TEL、E-mail)をメールでお知らせください。)

<申込期限>平成28年8月3日(水)

【申込窓口】豊橋技術科学大学

研究支援課センター支援係 白井・榊原

E-mail : kencen@office.tut.ac.jp

TEL : 0532-44-6574

受講料 無料